

イオンビームスパッタリング又は電子ビーム蒸着を利用した高反射・高耐力ミラーです。

波長は266nm～1550nmの間で入射角0°及び45°を取り揃えております。

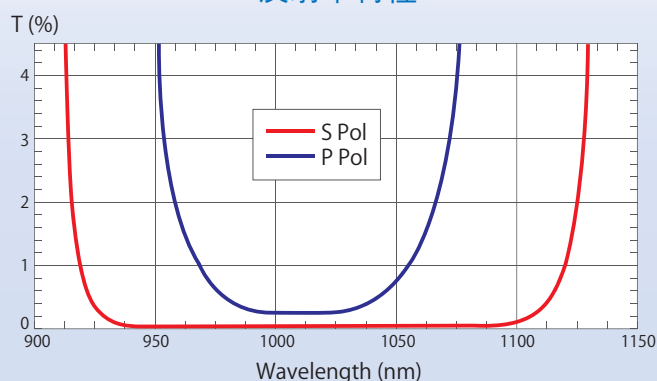
また、1ヵ月に1000個の生産能力を持ち、0.19um～20umの範囲で特注対応が可能です。



標準仕様

外径：φ25.4
 外径公差：+0/-0.1 mm
 厚さ公差：±0.1 mm
 有効径：> 90 %
 スクラッチディグ：20～10 S-D
 面精度：< λ/8@632.8 nm
 面取り：<0.25 mm x 45°
 付着力及び耐久性：Per MIL-C-675A

反射率特性



反射率

入射角0° (φ12.5, φ25.4, φ50.8共通です)

波長 (nm)	266	343～355	515	527-532	633	780	1030	1020～1070	1047～1064	1550
反射率 (%)	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5

入射角45° (φ12.5, φ25.4, φ50.8共通です)

波長 (nm)	266	250～266	343～355	515	527-532	633	780	1030	1020～1070	1047～1064	1550
反射率 (%)	>99.5/ >98.5	>99.6/ >99.0	>99.5/ >99.0	>99.5/ >99.0	>99.6/ >99.0	>99.5/ >99.0	>99.5/ >99.0	>99.6/ >99.0	>99.8/ >99.6	>99.5/ >99.0	>99.5/ >99.0

コーティング仕様例

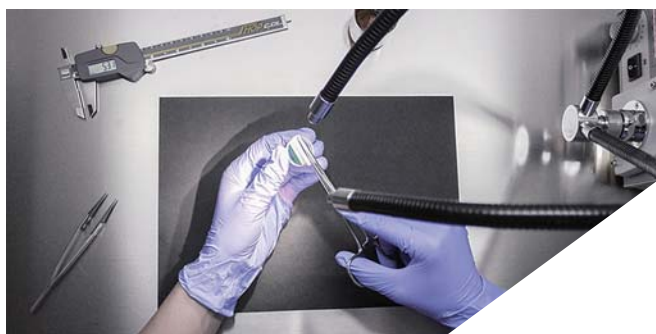
Atechnaではナノ秒レーザーだけではなくフェムト秒を含んだ複数のレーザーを用いて耐力試験を行っております。

波長	入射角	レーザー耐力試験仕様
HR@250～266 nm	45 deg	1.4 J/cm ² @266 nm; 3.8 ns; 50 Hz
HR@343～355 nm	45 deg	3.4 J/cm ² @355 nm; 4.8 ns; 50 Hz
HR@510～532nm+HT@1010～1070 nm	45 deg	13.9 J/cm ² @532 nm; 5.2 ns; 50 Hz
HR@510～532nm+HT@1020～1070nm	45 deg	9.0 J/cm ² @532 nm; 5.2 ns; 50 Hz
HR@1020～1070 nm	45 deg	15.8 J/cm ² @1064 nm; 7.4 ns; 50 Hz
HR@527～532 nm	45 deg	35.2 J/cm ² @532 nm; 6.2 ns; 50 Hz
HR@650 nm	0～15 deg	1.7 J/cm ² @1030 nm; 305 fs; 1 kHz
HR@1000～1060 nm	0～30 deg	0.6 J/cm ² @1030 nm; 320 fs; 50 kHz
HR@1000～1060 nm	0～30 deg	12.7 J/cm ² @1064 nm; 3.6 ns; 10 Hz
HR@1030 nm	45 deg	24.25 J/cm ² @1064 nm; 5.4 ns; 10 Hz
HR@1030～1070 nm	45 deg	12.2 J/cm ² @1064 nm; 3.6 ns; 10 Hz
HR@1030 nm ±20nm	0 deg	0.685 J/cm ² @1030 nm; 333 fs; 50 kHz

アルテクナはリトアニア国にある高品質のレーザ用光学部品を提供する急成長中のメーカーです。

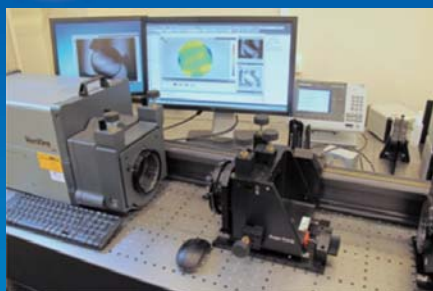
2000m²の広大な近代的なテクノロジーパークを持ち、お客様の仕様に合わせて設計から製造まで一貫して製作することもできます。

また、最先端の電子ビーム蒸着装置、スパッタリング装置を保有し、優れた品質管理体制も整っております。

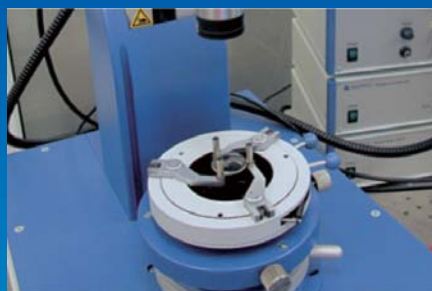


品質管理体制

Altechnaは品質管理を最も重要視しております。
多様な高精度の測定機器を用いてその品質を保っております。



干渉計



高精度レンズ測定器



ゴニオメーター



郡遅延分散測定器



スペクトロメーター



スクラッチディグ測定器